07;12 Модулятор ИК-излучения на эффекте магнитопропускания в манганите лантана, работающий вблизи комнатной температуры

© Ю.П. Сухоруков, Н.Н. Лошкарева, А.В. Телегин, Е.В. Мостовщикова, В.Л. Кузнецов, А.Р. Кауль, О.Ю. Горбенко, Е.А. Ганьшина, А.Н. Виноградов

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург E-mail: suhorukov@imp.uran.ru Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию 12 мая 2003 г.

Изготовлен макет и измерены оптические характеристики модулятора инфракрасного излучения, работающего на основе эффекта гигантского магнитопропускания света в пленке La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ} вблизи комнатной температуры при T = 303 К. Глубина модуляции модулятора меняется от 3.5 до 6.5% в диапазоне длин волн от 1.4 до 11 μ m. Показана возможность увеличения глубины модуляции модулятора.

Обнаруженные нами эффекты гигантского магнитопропускания (МТ-magnetotransmission) и существенного температурного изменения вблизи температуры Кюри (T_C) интенсивности прошедшего через манганит инфракрасного (ИК) излучения показали, что среди оптических материалов ИК-области спектра появился новый функциональный материал, оптические свойства которого существенно зависят от изменения магнитного поля и/или температуры [1–4]. Эффекты наблюдались в монокристаллах и эпитаксиальных пленках манганатов различного состава. Величина МТ достигала нескольких десятков процентов, что позволило сделать предположение о возможности широкого применения обнаруженных эффектов в оптоэлектронике, в том числе при создании магнитоуправляемого модулятора ИК-излучения.

Ранее большой эффект изменения ИК-поглощения в магнитном поле (магнитопоглощение) был обнаружен нами в магнитной полупроводниковой шпинели HgCr₂Se₄ [5]. Магнитопоглощение (или магнитопропус-

55

кание) в HgCr₂Se₄ объяснялось особенностями зонной структуры, обусловленными взаимодействием свободных носителей заряда с локализованными магнитными моментами ионов Cr³⁺. Для *n*-HgCr₂Se₄ максимум эффекта наблюдался при T_C для *p*-HgCr₂Se₄ при $T < T_C$. Температура Кюри HgCr₂Se₄ и, следовательно, рабочая температура модулятора была довольно низкой $T_C = 115$ К. В манганитах в зависимости от ввида легирования T_C может изменяться в диапазоне температур от 80 до 360 К, следовательно, модулятор на основе магнитопропускания света в манганите может работать и при комнатной температуре. В настоящей работе предложен модулятор инфракрасного излучения на основе эффекта гигантского магнитопропускания в пленке манганита La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+δ}, работающий вблизи комнатной температуры.

Магнитооптический элемент (МЭ) модулятора изготовлен из эпитаксиальной пленки La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+δ} со структурой перовскита толщиной $d = 300 \,\mathrm{nm}$, выращенной на монокристаллической подлож-(001) LaAlO₃ со структурой перовскита методом химического осаждения из паровой фазы металлорганических соединений (MOCVD) при температуре подложки 750°С. Для предотвращения потерь и повышения активности Na в ходе синтеза был произведен отжиг пленки при 750° на воздухе в течение 6 h в засыпке брутто-состава La_{0.3}Na_{0.7}MnO₃, полученной методом химической гомогенизации из нитратных растворов. Исследования методами просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, сканирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом и рентгеновской дифракции, включая данные ϕ - и ω -сканирования соответствующих рефлексов пленки и подложки, показали, что полученная пленка является однофазной и обладает высоким структурным совершенством. Структура перовскита в пленке характеризуется ромбоэдрическим искажением (группа $R\bar{3}c$), типичным и для объемных материалов состава $La_{1-x}Na_xMnO_{3+\delta}$ [6]. На поверхности пленки не наблюдались частицы вторых фаз или другие дефекты.

Выбор пленки La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ} для создания МЭ был обусловлен ее температурой Кюри $T_C = 303$ К, близкой к комнатной. Температура Кюри была определена по температуре минимума первой производной температурной зависимости экваториального эффекта Керра (transversal Kerr effect — TKE) — аналога температурной зависимости намагниченности. Резкий рост амплитуды в окрестности T_C и большая величина ТКЕ в малом поле $H \sim 3.5$ kOe при $T \sim 100$ K (вставка к рис. 1)



Рис. 1. Температурные зависимости интенсивности прошедшего через пленку La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ} света при $\lambda = 8.8 \,\mu$ m в отсутствие магнитного поля (*1*) и в поле 8 kOe (*2*). На вставке — температурная зависимость ТКЕ при энергии 2.8 eV и в поле 3.5 kOe.

являются характерными для ферромагнетиков. Характер изменения ИКпоглощения в пленках в окрестности T_C и при приложении магнитного поля наглядно демонстрируют температурные зависимости интенсивности прошедшего через пленку света (пропускания), измеренные при длине волны $\lambda = 8.8 \,\mu$ m (рис. 1). Существенное увеличение пропускания при T > 200 K связано с переходом металл–изолятор в пленке. Внешнее магнитное поле величиной 8 kOe приводит к уменьшению пропускания света пленкой (кривая 2, рис. 1). Относительное изменение пропускания света под действием магнитного поля — магнитопропускание, определяется как MT = $(Y_0 - Y_H)/Y_0$, где Y_0 и Y_H — интенсивности прошедшего через МЭ света в отсутствие и при наличии магнитного поля. Абсолютная величина MT в пленке достигает ~ 9% вблизи T_C при 303–307 K (рис. 2).



Рис. 2. Температурные зависимости магнитопропускания (левая ось) и глубины модуляции модулятора на основе пленки La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ} (правая ось) в магнитном поле 8 kOe и $\lambda = 8.8 \,\mu$ m. На вставке — полевая зависимость глубины модуляции при 303 K в постоянном поле (сплошная линия) и в переменном магнитном поле (точки) при $\lambda = 8.8 \,\mu$ m.

Спектр МТ пленки La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ}, измеренный при $T = T_C$ (рис. 3) в магнитном поле 8 kOe, показывает наличие большого значения магнитопропускания в широком ИК-диапазоне длин волн от 1.4 до 11 μ m. Спектральная зависимость эффекта магнитопропускания с максимумами при длинах волн $\lambda \sim 1.7$ и $\sim 6.5 \mu$ m и ростом МТ при $\lambda > 8 \mu$ m, вероятно, связана с изменением под действием магнитного поля вклада в поглощение света как делокализованных, так и локализованных носителей заряда [7].

Основной рабочей характеристикой оптических модуляторов является глубина модуляции *m*, определяемая выражением:

$$m = (Y_{\text{max}} - Y_{\text{min}})/(Y_{\text{max}} + Y_{\text{min}}) = (Y_H - Y_0)/(Y_H + Y_0),$$

где $Y_{\text{max}}, Y_{\text{min}}$ — максимальная и минимальная интенсивности прошедшего через МЭ излучения [8]. Температурная и спектральная



Рис. 3. Спектр магнитопропускания (левая ось) и глубины модуляции модулятора на основе пленки $La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+\delta}$ (правая ось) в магнитном поле 8 kOe при температуре 303 K.

зависимости *m* имеют вид, подобный соответствующим зависимостям МТ пленки La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+ δ} (рис. 2, 3). Глубина модуляции достигает максимума ~ 4.5% при 303 К, т.е. при температуре, близкой к комнатной. Исследование оптических свойств манганитов лантана различных составов показали, что существует возможность значительного увеличения *m* модулятора. Например, в пленке La_{0.7}Na_{0.3}MnO₃ глубина модуляции достигает ~ 15% при величине магнитопропускания ~ 30% и температурах, близких к 0°C [3], а в пленке La_{0.35}Pr_{0.35}Ca_{0.3}MnO₃ значение *m* составляет ~ 25% при МТ ~ 50% и *T* = 175 K [2].

Магнитопропускание света в манганитах является четным по полю эффектом. Это приводит к тому, что промодулированный свет имеет частоту, равную удвоенной частоте источника переменного магнитного поля. Полевая зависимость *m* показывает, что существует широкий

диапазон магнитных полей, при которых глубина модуляции линейно зависит от магнитного поля (вставка на рис. 2). Величина магнитопропускания слабо зависит от направления магнитного поля вдоль или перпендикулярно плоскости пленки, что позволяет использовать различные геометрии расположения источника поля и МЭ при создании модулятора.

Полевые зависимости глубины модуляции в переменных магнитных полях частотой до 1 kHz (точки на вставке к рис. 2) показали те же значения *m*, что и в постоянном магнитном поле (сплошная линия на вставке к рис. 2). Амплитуда модуляции измерялась фотоприемником (CdHgTe) с использованием активного фильтра высоких частот с частотой среза 100 Hz. Быстродействие модулятора на магнитопропускании в манганитах лантана определяется процессами перемагничивания. Данные по прохождению электромагнитных волн в манганитах La_{0.67}Pb_{0.33}MnO₃ ($T_C = 347$ K) и La_{0.60}Y_{0.07}Ba_{0.33}MnO₃ ($T_C = 319$ K) показали, что при $T = 300 \,\mathrm{K}$ и в постоянном магнитном поле 3 kOe увеличение частоты электромагнитного поля до 10 MHz не уменьшает величины магнитосопротивления [9]. Скорость перемагничивания манганита в переменном магнитном поле определяется величиной скинслоя $\delta = (2\rho/\omega\mu)^{1/2}$, где ρ — удельное электросопротивление МЭ, ω частота переменного магнитного поля, μ — магнитная проницаемость МЭ. При условии $\delta > d = 300 \,\mathrm{nm}$ частота перемагничивания пленки манганита $La_{0.82}Na_{0.18}MnO_{3+\delta}$ при T = 303 К может достичь величины $\sim 10^9$ Hz при $\mu < 5$ [9] и $\rho = 10^{-4} \,\Omega \cdot m$. Однако существуют технические ограничения быстродействия модулятора, связанные с частотными характеристиками источника переменного магнитного поля. Используемый нами источник поля позволил провести модуляцию ИК-излучения на частотах до нескольких килогерц.

Модулятор на основе магнитопропускания инфракрасного излучения в манганитах является исключительно простым оптическим устройством, содержащим только магнитооптический элемент из манганита и источник магнитного поля.

Работа была поддержана ФЦНТП (грант 40.012.1.1.1153–7/02), РФФИ (гранты 02–02–16429, 03–02–06032 и 02–03–33258), Проектом ООФА РАН "Оптические и магнитотранспортные явления в манганитах с колоссальным магнитосопротивлением".

Список литературы

- Loshkareva N.N., Sukhorukov Yu.P., Gizgevskii B.A. et al. // Phys. Stat. Sol. (A). 1997. V. 164. P. 863–866.
- [2] Сухоруков Ю.П., Лошкарева Н.Н., Ганьшина Е.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. В. 3. С. 6–13.
- [3] Sukhorukov Yu.P., Ganshina E.A., Belevtsev B.I. et al. // J. Appl. Phys. 2002.
 V. 91. N 7. P. 4403–4408.
- [4] Сухоруков Ю.П., Лошкарева Н.Н., Ганьшина Е.А. и др. // ЖЭТФ. 2003. Т. 123. В. 1. С. 293–305.
- [5] Лошкарева Н.Н., Сухоруков Ю.П., Гижевский Б.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 17. С. 83–86.
- [6] Rao G.H., Sun J.R., Barner K. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 1999. V. 11. P. 1523–1528.
- [7] Лошкарева Н.Н., Сухоруков Ю.П., Нейфельд Э.А. и др. // ЖЭТФ. 2000. Т. 117. В. 2. С. 440–448.
- [8] Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. М.: Наука, 1970. 296 с.
- [9] Rinkevich A., Nossov A., Ustinov V. et al. // J. Appl. Phys. 2002. V. 91. N 6. P. 3693–3697.